

工作简讯

γ 闪烁谱仪测定 $\sim(235)\text{U}$ 含量

@王德民\$北京大学技术物理系 @朱芝仙\$北京大学技术物理系 @徐通敏\$北京大学技术物理系 @邓坤杰\$北京大学技术物理系

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

摘要 <正> 一、引言 用 γ 闪烁谱仪测定经过浓集或贫化的天然铀中的 $\sim(235)\text{U}$ 含量,虽然准确度不如质谱方法,但有其长处,如仪器简单,实验方法容易掌握等。随着半导体探测器的发展,还可以进一步提高准确度。可以选择 $\sim(235)\text{U}$ 的184千电子伏 γ 射线来比较浓集(或贫化)铀样品与天然铀样品(当作参比样品)的 γ 射线强度,将其比值(我们称丰度比)乘以天然铀(或已知含量的参比

关键词

分类号

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(344KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者